

# XRR 解析レポート

## プロジェクト

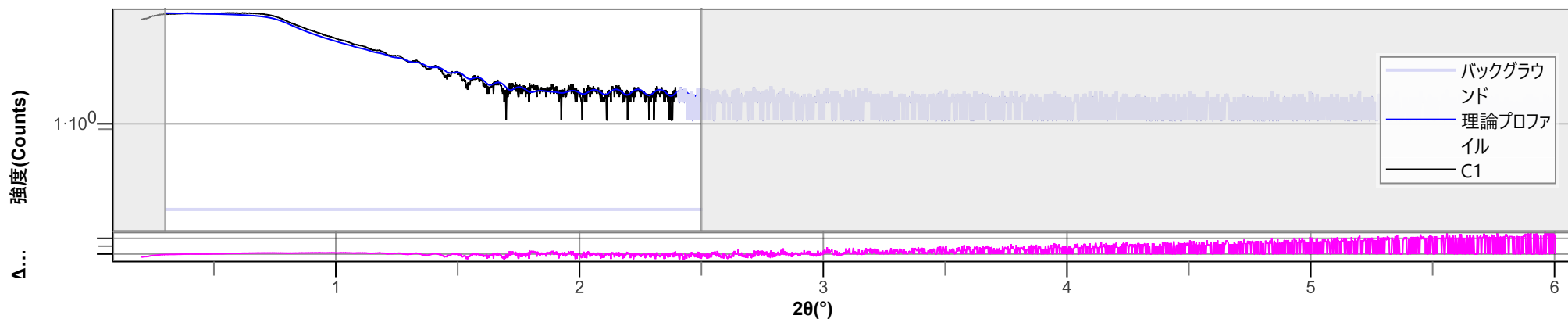
パス: 未保存  
DBでの共有レベル: 共有

## 解析条件

波長(nm): 0.15403	フィッティング手法: 遺伝的アルゴリズム	装置関数: 擬Voigt関数
点数: 2901	データ間隔: 1点ごとにフィッティング	ローレンツ関数の比率: 0.00
2θ(°): 開始 = 0.200, 終了 = 6.000	残差タイプ:  Δ(LogI)	ローレンツ幅: 1.00e-002
ステップ = 0.002	母集団: 50	ガウス幅: 4.00e-002
オフセット = 0.000e+000	個体数: 50	
	ターゲットχ <sup>2</sup> : 1.00e-004	
	重み: 50%	
	クロスオーバー: 50%	

## 結果

### プロファイルプロット



	使用	層番号 ▼	材料	膜厚(nm)<th>	密度(g/cm³)<d>	粗さ(nm)<rg>	
	<input checked="" type="checkbox"/>	L4	Fe2O3	2.596 ±1.4 Const 精密化	4.95000 Const	1.085 ±0.02 Con... 精密化	
	<input type="checkbox"/>	L3	Fe2O3	0.013 Const	4.95000 Const	3.538 Con...	
	<input checked="" type="checkbox"/>	L2	Fe	90.996 ±0.15 Const 精密化	7.97400 Const	0.810 ±0.018 Con... 精密化	
	<input type="checkbox"/>	L1	Fe	0.600 Const	4.50000 Const	0.200 Con...	
	<input checked="" type="checkbox"/>	基板	Si	∞	2.32924 Const	0.500 Con...	